朝陽科技大學
111學年度第1學期教學大綱

當期課號	2730			中文科名	積體電路測試系統
授課教師	陳宏達			開課單位	資訊工程系
學分數	3	修課時數	3	開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業選修				
類別	一般課程				

本課程培養學生下列知識：

本課程的主要目的要讓學習者瞭解積體電路測試設備的特性與種類、基本操作原理，包含以下內容：測試系統簡介、基本測試電路、測試機結構及商用測試系統、分類機、針測機與測試治具介紹。本課程之課程目標為：

1.測試系統簡介
2.類比IC測試機結構及商用測試系統
3.數位IC測試機結構及商用測試系統
4.記憶體IC測試機結構及商用測試系統
5.混合訊號IC測試機結構及商用測試系統
6.分類機、針測機與測試治具

Course objective is to provide students with a comprehensive understanding of IC test equipments. The course outline is as follows: test system introduction, basic test circuits, tester architecture, commercial tester, handlers, probers, and test tools. 1.Introduction to ATE 2.Structure of Analog Tester and Commercial Testers 3.Structure of Digital Tester and Commercial Testers 4.Structure of Memory Tester and Commercial Testers 5.Structure of Mixed-Signal Tester and Commercial Testers 6.Introduction to Handler, Prober and Test Fixture

每週授課主題

第01週：課程與測試系統簡介
第02週：IC 封裝與測試
第03週：IC 封裝與Tester
第04週：測試系統與靜電放電
第05週：測試系統結構1
第06週：春假
第07週：測試系統結構2
第08週：問題釋疑
第09週：期中評量
第10週：商用測試系統1
第11週：商用測試系統2
第12週：測試週邊系統1
第13週：測試治具 1
第14週：測試治具 2
第15週：測試系統維修校正與保養1
第16週：測試系統維修校正與保養2
第17週：問題釋疑
第18週：期末評量

成績及評量方式

期中考：20%
期末考：20%
平常考：30%
平常分數(缺課逾18節本項0分)：30%

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

1.https://honda-chen.tw(教師網頁)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

1.無

教師資料

教師網頁：http://honda-chen.tw
E-Mail： honda@cyut.edu.tw
Office Hour：
星期二,第3~4節,地點:M-313;
星期五,第1~2節,地點:M-313;
分機:4340、4340

[關閉] [列印]

尊重智慧財產權，請勿不法影印。